和周波発生(SFG)分光法による硫酸水溶液表面の研究

(産総研¹・東北大²・分子研³・名大理⁴) 〇宮前孝行¹・森田明弘^{2,3}・大内幸雄⁴

【序】硫酸水溶液の表面構造は、大気化学における硫酸エアロゾルの表面構造のモデル系として 長く注目されてきている。中緯度成層圏に存在する硫酸エアロゾルは不均質反応の反応場に関わ る物質として、オゾン層破壊や地球温暖化をはじめ地球規模での環境変化に様々な影響を与えて いる。一方で和周波発生(SFG)分光法は2次の非線型光学過程を利用した測定手法で、固体に限ら ず表面・界面における分子種の同定、分子配向・分子配座を知ることのできる有力な手法であるが、 これまでの SFG を使った硫酸水溶液表面の研究では、何れも水の OH 伸縮振動領域のみ測定で、 硫酸のモル分率が 0.4 以上で表面の OH 伸縮振動が消失するという挙動が確認されているが。こ の挙動に関しては2つの全く異なった解釈がなされ^{1,2)}、その表面構造は未だ明らかになっていな い。また、表面での硫酸の解離がバルクと異なるのか等しいのかといった基本的な命題も未解決 のままである。今回我々はこの硫酸水溶液表面について、低振動数領域での SFG 測定を行い新た な知見を得たので報告する。

【実験】SFG の測定はピコ秒モードロック Nd:YAG レーザーを光源とし、AgGaS₂上もしくは GaSe 上で LBO 結晶からの OPO/OPG と YAG の基本波の差周波により波長可変の赤外光を取り出し、 これと 532nm の可視光を試料に 50°と 70°で入射し、発生した和周波をフィルターと分光器を通し た後、PMT で検出した。レーザーの出力は 1000nm での赤外光~100μJ、可視光~1.2mJ で、大気中 で測定を行った。硫酸水溶液は、98%濃硫酸(和光純薬)と、純水(18MΩ·cm)を混合して作成したも のを使用した。

【結果と考察】図 1 の硫酸イオンと硫酸イオン の化学構造からわかるように硫酸分子は C_{2v} 対 称であり、bisulfate イオンになると C_{3v} 、sulfate イオンでは T_d 対称に分子の対称性が変化し、酸 解離に伴いそれぞれが与える振動数も変化する。 sulfate イオンは、1104cm⁻¹に SO₃ 逆対称伸縮振動、 981cm⁻¹に SO₄ 全対称伸縮振動を与え、bisulfate イオンでは、1040cm⁻¹付近に SO₃の対称伸縮、 1130~1150cm⁻¹に SO₃ 逆対称伸縮が現れる。また 硫酸分子では 1160cm⁻¹に SO₂ 対称伸縮、1360cm⁻¹ に SO₂ 逆対称伸縮が存在する ³⁾。これらのピーク 挙動を SFG で見ることで表面での原理的に硫酸 分子種の解離状態を特定することが可能となる。

図 2 に硫酸水溶液の濃度を変えて測定した SFG スペクトルを示す。測定は全て SSP(SFG; S 偏光、VIS; S 偏光、IR; P 偏光)で行った。硫酸水



図1 硫酸分子と硫酸イオンの化学構造



 \boxtimes 2 SFG spectra of H₂O/H₂SO₄ solutions at the air/liquid interface.

溶液の濃度がモル分率で0.4までの領域では、 1060cm⁻¹にピークが見られ、その強度は増加 していく。その後濃度が増加するとこのピー ク強度は急速に減少し、変わって1150cm⁻¹に 別のブロードなピークが現れる。重水素化し た硫酸と重水の混合溶液を用いた測定から、 両者のピークはそれぞれ、bisulfate イオンの SO₃対称伸縮と硫酸分子の SO₂対称伸縮に帰 属された。それぞれのスペクトルからピーク 強度の濃度変化をプロットしたのが図3であ る。比較のために Raman の測定結果によるそ れぞれの化学種の存在比をあわせて載せてあ る⁴。まず Raman の結果と SFG とを比較して 考察すると、Raman の測定で bisulfate イオン



 \boxtimes 3. Strengths of the *s*-SO₃ and *s*-SO₂ peaks (filled squares) of the SFG of H₂O/H₂SO₄ solutions and the bulk concentration of HSO₄⁻ and H₂SO₄ species from the Raman data (open circles) as functions of acid concentration.

の濃度の増加及び減少(図 3 の緑線)と SFG の bisulfate イオンのピーク強度の増加及び減少(赤線) の傾向は比較的良い一致を示しており、バルクでの硫酸の酸解離と表面での解離については大き な違いがなく、バルクとほぼ同じ濃度で硫酸の第一解離が起こっていることがわかる。ただし SFG では bisulfate イオンのピーク強度は単調に増加するのではなく、モル分率が 0.2 から 0.4 の領域で 若干特異な挙動をしており、これは水溶液の表面構造に何らかの特異な変化が現れたためである と推測される。また、SFG と Raman 両者とも硫酸のモル分率が 0.4 以上で硫酸分子由来のピーク が現れているが、Raman ではその存在比は濃度の上昇とともに増加していくのに対して、SFG で はモル分率 0.6 以上ではほぼ一定値をとっている。このことは硫酸の濃度がモル分率 0.6 以上では、 表面は解離していない硫酸分子に覆われていることを示している。

SFG では面内に異方性がない場合、表面法線方向に配向している分子種が存在している場合に その分子種の振動に共鳴してピークが検出される。SFG で bisulfate イオンと硫酸分子の振動が明 瞭に見えていることから表面ではこれらの分子種が何らかの配向を有していることを示唆してい る。当日は硫酸水溶液表面の構造についても議論を行う。

- (1) C. Radüge, V. Pflumio, Y. R. Shen, Chem. Phys. Lett., 274 (1997) 140.
- (2) S. Baldelli, C. Schnizer, M.J. Shultz, D. J. Cambell, J. Phys. Chem., B 101 (1997) 10435.
- (3) A. B. Horn, K. J. Sully, Phys. Chem. Chem. Phys. 1 (1999) 3801.

(4) T. F. Young, L. F. Maranville, H. M. Smith, in *The Structure of Electrolytic Solutions*; J. H. Hamer, Ed, John Wiley & Sons: New York, 1959; pp 35–63.